

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH • Merianstr. 28 • 63069 Offenbach

Renesas Electronics Corporation
5-20-1 Josuihon-cho
KODAIRA-SHI, TOKYO 187-8588
Japan

Offenbach, 2024-12-19

Your ref.

Your letter
2024-12-16

Our ref. - please indicate
5027124-4970-0001/325604
TL2/swa

Contact
Mr. Schwab
Tel +49 69 8306 607
Fax +49 69 8306 606
ralf.schwab@vde.com

Micro controller

Translation: In any case the German version shall prevail

PRÜFBERICHT zur Information des Auftraggebers

Test Report for the Information of the applicant

Produkt / Product:

Typ / Type: RA8 (RA8M1)

Dear Sirs,

dieser Prüfbericht enthält das Ergebnis einer einmaligen Untersuchung an dem zur Prüfung vorgelegten Erzeugnis. Ein Muster dieses Erzeugnisses wurde geprüft, um die Übereinstimmung mit den nachfolgend aufgeführten Normen bzw. Abschnitten von Normen festzustellen. Die Prüfung wurde durchgeführt vom 2024-12-16 bis 2024-12-18.

This test report contains the result of a singular investigation carried out on the product submitted. A sample of this product was tested to found the accordance with the thereafter listed standards or clauses of standards resp. The testing was carried out from 2024-12-16 to 2024-12-18.

Der Prüfbericht berechtigt Sie nicht zur Benutzung eines Zertifizierungszeichens des VDE und berücksichtigt ausschließlich die Anforderungen der unten genannten Regelwerke.

The test report does not entitle for the use of a VDE Certification Mark and considers solely the requirements of the specifications mentioned below.

Wenn gegenüber Dritten auf diesen Prüfbericht Bezug genommen wird, muss dieser Prüfbericht in voller Länge an gleicher Stelle verfügbar gemacht werden.

Whenever reference is made to this test report towards third party, this test report shall be made available on the very spot in full length.

REMARK: VDE DETAIL TESTREPORT REFERENCE: VDE 324848-TL2-1

I – ANGEWENDETE STANDARDS / STANDARDS APPLIED

DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2024-07
EN 60335-1:2012+AC+A11+A13+A1+A2+A14-A16:2023
ANHANG R; KLASSE R1
ANNEX R; CLASS R1

IEC 60335-1:2020
ANHANG R; KLASSE R1
ANNEX R; CLASS R1

DIN EN 60730-1 (VDE 0631-1): 2021-06
ANHANG H; KLASSE B
ANNEX H; CLASS B

IEC 60730-1: 2022
WEITERHIN/FURTHERMORE
IEC 60730-1:2013
IEC 60730-1:2013/AMD1:2015
IEC 60730-1:2013/AMD2:2020
ANHANG H; KLASSE B
ANNEX H; CLASS B

ANMERKUNG: Die Anforderungen der Normenreihe 60730-1 Anhang H Ausgabedaten 2022 und 2020 sind vergleichbar.

REMARK: The requirements of 60730-1 annex H for class B are comparable between the 60730-1 versions of 2020 and 2022.

ANMERKUNG: Die Anforderungen der Normenreihe 60730-1 Tabelle H für Klasse B und der 60335-1 Tabelle R1 für Klasse R1 sind vergleichbar.

REMARK: The requirements of 60730-1 table H for class B are comparable to table R1 of 60335-1 for class R1.

II – SELBSTDIAGNOSE ROUTINEN / SELF-DIAGNOSTIC ROUTINES ENGLISH DESCRIPTION ONLY		
SOFTWARE CLASS B	PROVIDED SELF DIAGNOSIS ROUTINES	MEASURES
TABLE H2; CLAUSE 1.1 CPU TEST REGISTER TEST	<ul style="list-style-type: none"> *GENERAL PURPOSE REGISTERS R0-R12 CONTROL REGISTERS PSP, MSP, LR, APSR, BASEPRI, CONTROL, PSPLIM, MSPLIM PROGRAM COUNTER REGISTER *FPU REGISTER TEST S0~S31 FPU CONTRTOL REGISTER CPACR, FPCCR, FPCAR, FPSCR, FPDSCR 	STATIC TEST ALGORITHMS USING 0 AND 1 PATTERNS *TESTS CAN BE FOR STUCK AT OR COUPLING FAILURES PROGRAM COUNTER REGISTER TESTED WITH RETURN VALUE FUNCTIONS ARE SUPERVISED BY LOGICAL SEQUENCE MONITORING
TABLE H2; CLAUSE 1.3 PC TEST PROGRAM COUNTER TEST	<ul style="list-style-type: none"> PROGRAM COUNTER 	REGISTER TEST FOR PC PLUS SEQUENCE MONITORING USING BIT-PATTERNS WITH REDUNDANT INVERSE STORAGE COMPARISON
TABLE H2; CLAUSE 3 CLOCK TEST	<ul style="list-style-type: none"> CLOCK TEST 	COMPARISON OF TWO DIFFERENT OSCILLATORS USING THE TIMER ARRAY UNIT MAIN, SUB_CLOCK, HOCO, MOCO, LOCO, PCLKB OSCILLATORS CAN BE SELECTED FOR COMPARISON FREQUENCY ACCURACY MEASUREMENT CIRCUIT (CA) IS USED FURTHERMORER CLOCK LOSS CAN BE DETECTED
TABLE H2; CLAUSE 4.1 ROM TEST	<ul style="list-style-type: none"> ROM TEST USING 32 BIT CRC (CCITT) 	ROM TEST USING 32 BIT CRC ALGORITHM
TABLE H2; CLAUSE 4.2 RAM TEST	<ul style="list-style-type: none"> MARCH C- TEST MARCH X TEST STACK AREA TEST 	STATIC MEMORY TESTS DESTRUCTIVE DATA MUST BE RESCUED IN FINAL APPLICATION
TABLE H2; CLAUSE 7.1 DIGITAL I/O TEST	<ul style="list-style-type: none"> GPIO LOOPBACK TEST 	SET AND READOUT TEST <i>NOTE: ADDITIONAL TESTS MAY BE NECESSARY IN THE FINAL APPLICATION TO DETECT HARDWARE FAILURE CONDITIONS</i>
TABLE H2; CLAUSE 7.2.1 ADC TEST	<ul style="list-style-type: none"> TEST VERSUS 3 REFERENCE VOLTAGES 	REFERENCE VOLTAGE READOUT TEST
TESTS NOT SPECIFIED IN TABLE H2	<ul style="list-style-type: none"> WATCHDOG TIMER TEST 	WDT UNDERFLOW TEST DURING STARTUP

III – TESTMETHODIK / TEST METHODOLOGY

Die vorliegenden Dokumente wurden geprüft.

Die vorgelegten Funktionen wurden unter Zuhilfenahme einer Testumgebung aus IN-CIRCUIT EMULATOR / DEBUGGER und einem Evaluation Board geprüft, die Prüfungen fanden vom 2024-12-16 bis zum 2024-12-17 statt. Teilnehmende waren die maßgeblichen Entwickler der Fa. Renesas und ein Experte des VDE Institutes.

The provided documents have been checked.

The provided functions have been tested using the IN-CIRCUIT EMULATOR / DEBUGGER and an evaluation board during a witness test session dated 2024-12-16 to 2024-12-17 participating development staff of RENESAS and an expert of VDE.

IV – ERGEBNIS / RESULT

Die unter II benannten Selbst-Diagnose-Routinen erfüllen die Anforderungen der unter I benannten Normen. Die unter II benannten Selbst-Diagnose-Routinen können zum Aufbau einer Selbst-Test-Bibliothek gemäß der unter I benannten Normen verwendet werden

The self-diagnostic routines mentioned under II fulfill the requirements of the standards mentioned under I. The self-diagnostic routines mentioned under II are suitable to be used to create a self-test library according the standards mentioned under I.

Best regards

VDE Testing- and Certification Institute

Ralf Schwab



Korkut Tas

